

デバイス開発試験・出荷検査向け

超高周波数振動試験機【0.5Hz～350kHz】

用途

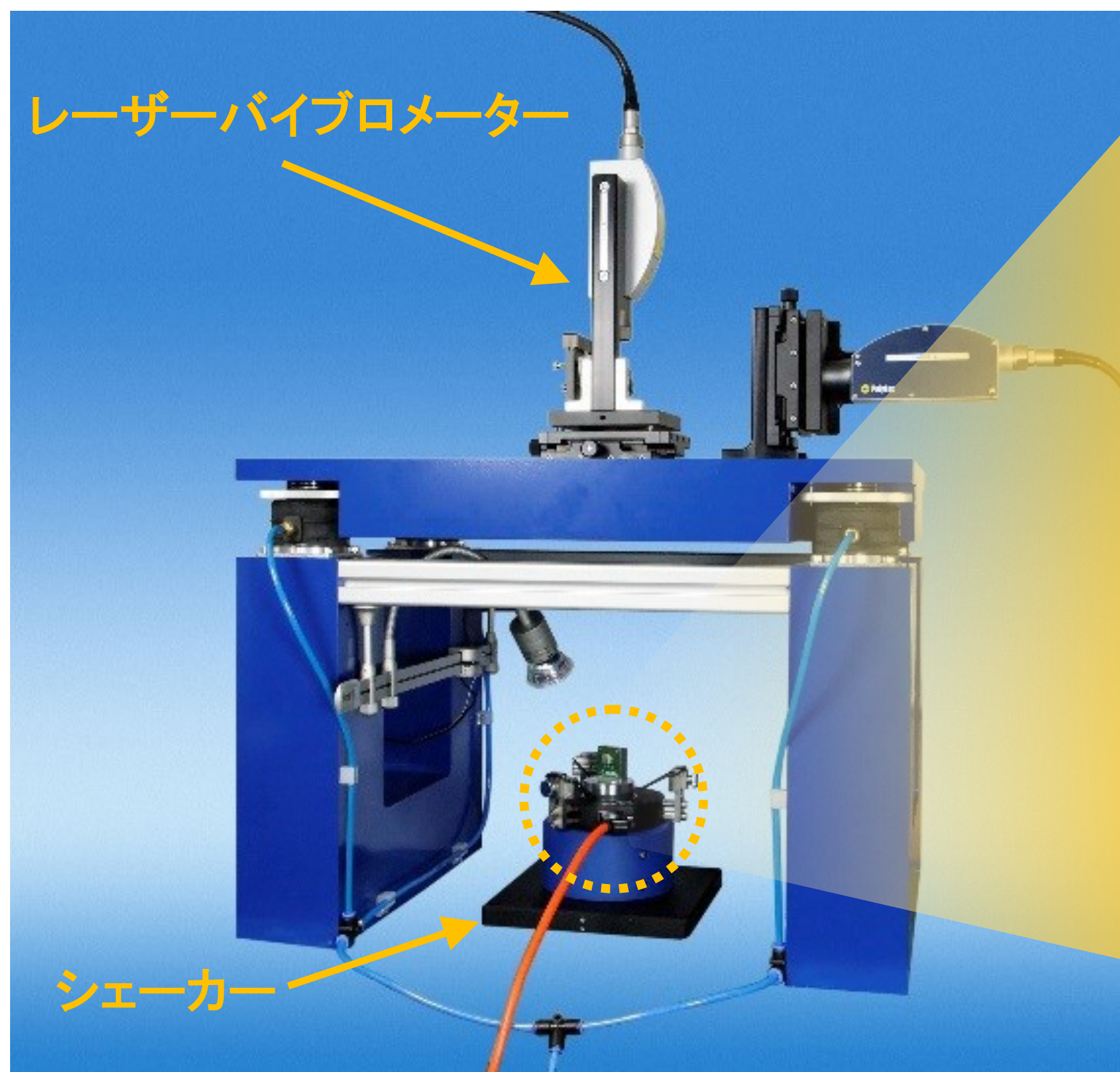
- ◆ ECUの振動試験、出荷検査
- ◇ 電子部品の品質管理
- ◆ センサー開発 etc...

構成例) シェーカー: SE-09

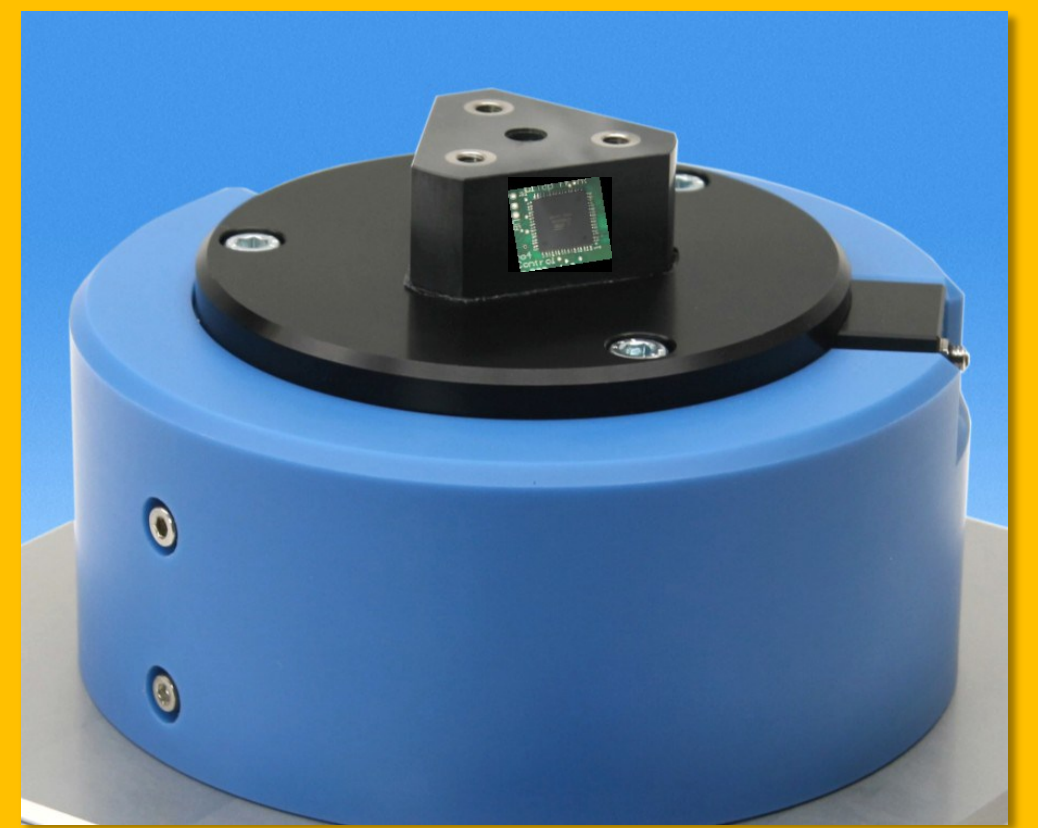
- ・周波数 ~ 50,000 Hz
- ・加速度 ~ 400 m/s²

この構成ではデバイス(試験品)の挙動をレーザーバイプロメーターで計測し、変位での評価をしています。デバイスからの出力(電圧、電流など)をシステムに取り込み評価することも可能です。

デバイス出力をコントロールシステムへ

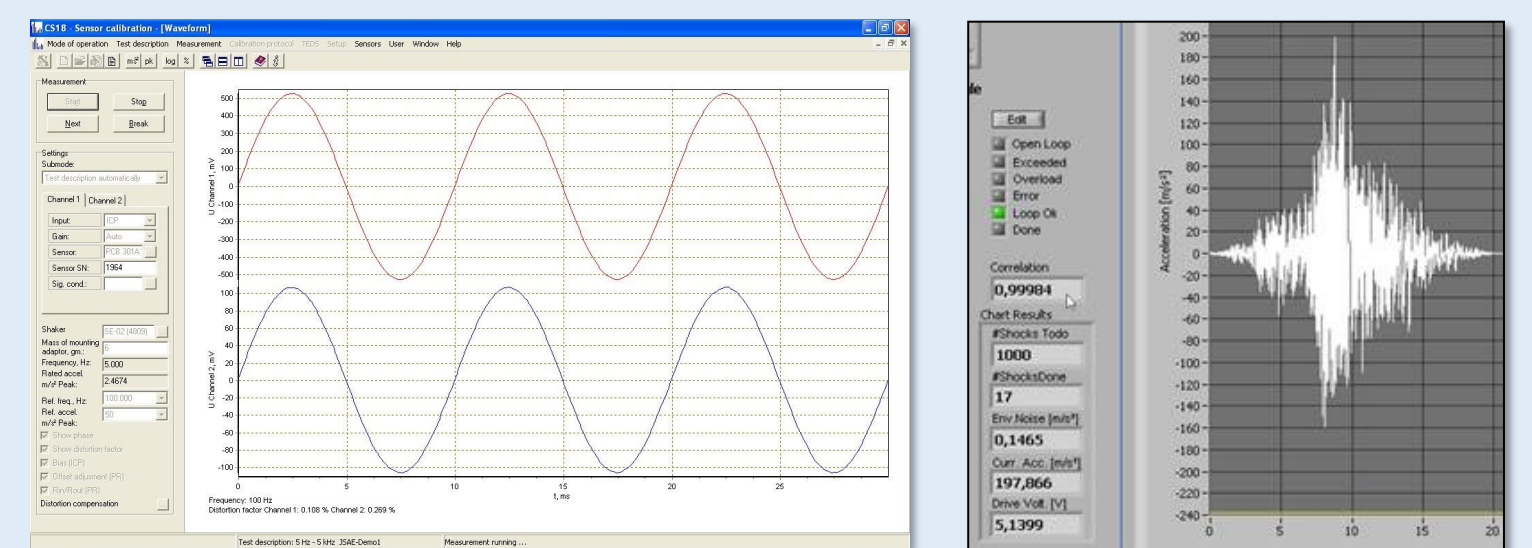


異常振動を検知



SPEKTRA社の製品では、350kHzまでの高周波振動試験を可能にします。共振をはじめとした振動特性を計測でき、性能向上を図る開発試験において欠かせないソリューションです。また生産ラインでの抜き打ち出荷検査として、不良品検知率を上げ品質向上に貢献します。SPEKTRA社は、振動・音響の校正機製造で培った長年の技術や経験を生かし、デバイス開発試験や高品質管理を目的とした最先端のソリューションやサービスを提供致します。

各種試験波形を生成可能



サイン波、ランダム波、スイープ加振、フィールドデータの再現など様々な試験条件を生成します。

型式	SE-16	SE-11	SE-09	SE-13
周波数	5,000 Hz - 100,000 Hz	1,000 Hz - 50,000 Hz	5 Hz - 50,000 Hz	0 Hz - 400 Hz
加速度	400 m/s ²	400 m/s ²	600 m/s ²	60 m/s ²
ペイロード	5 グラム	10 グラム	350 グラム	25,000 グラム

※一部機種を抜粋して掲載しております。

●その他各種試験機もラインナップ

振動試験機(低周波数)

- ・周波数 DC~400Hz
- ・推進力 最大900N
- ・試験品重量 23kgまで



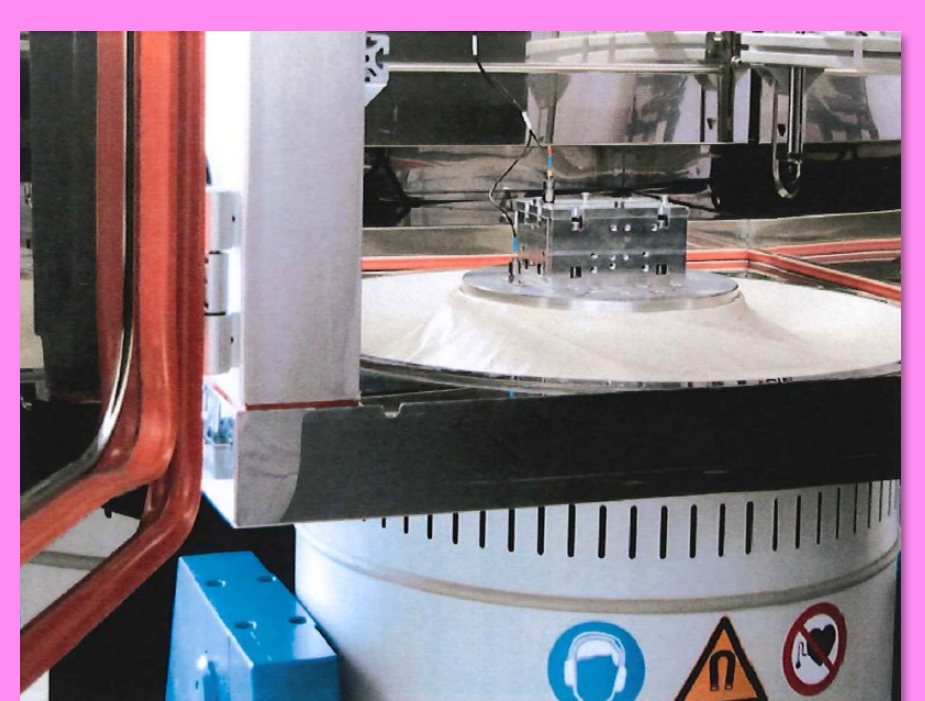
磁場試験機

- ・磁束密度 最大10mT
- ・試験品寸法(一様な磁場空間) 40mm角
- ・3軸AC/DCでの磁場生成が可能



温度試験機

- ・温度範囲 -80℃~+225℃
- ・温度変化速度 最大2000K/分
- ・振動/磁場試験機と組み合わせ可能



Produced by
SPEKTRA



日本総代理店
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社